

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Of[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [Se](#)

Welcome to IEEE Xplore®

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Print Format](#)

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)  
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)  
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Of[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#) 

» Se

Welcome to IEEE Xplore® Your search matched [0] of [979293] documents.

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Print Format](#)

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)  
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)  
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Of[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)

» Se

Welcome to IEEE Xplore®

Your search matched [0] of [981130] documents.

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

**Tables of Contents**

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

**Search**

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

**Member Services**

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

 [Print Format](#)

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)  
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)  
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved